64×64 InGaAs/InP 三维成像激光焦平面探测器

李 潇,石 柱,代 千,覃文治,寇先果,袁 鎏,刘期斌,黄海华

(西南技术物理研究所,四川 成都 610041)

摘 要:针对900~1700 nm 波长无扫描激光三维成像雷达的需求,研制了一种规模为64×64 的线性 模式雪崩焦平面阵列(LM-APD-FPA),它由 InGaAs/InP 雪崩光电二极管阵列与 CMOS 专用读出电路 (ASIC)组成。该器件采用飞行时间(TOF)测距的方式工作,APD 光敏芯片将脉冲激光信号转化成脉冲 光电流,读出电路对其进行放大、阈值比较后实现激光探测并在每个单元获取光脉冲的飞行时间,将 其转化成二进制编码信号后串行输出。测试结果表明,64×64 LM-APD-FPA 有效像元最小可探测光 功率值约为 400 nW,时间分辨率为 1 ns。用该探测器在激光雷达系统上实现了无扫描单脉冲激光 三维成像,表明了线性模式激光焦平面探测器可用于激光三维成像领域。 关键词:焦平面阵列; 线性模式; 铟镓砷; 飞行时间测距; 三维成像

中图分类号: TN247 文献标志码: A DOI: 10.3788/IRLA201847.0806004

64×64 InGaAs/InP 3D imaging laser focal plane detector

Li Xiao, Shi Zhu, Dai Qian, Qin Wenzhi, Kou Xianguo, Yuan Liu, Liu Qibin, Huang Haihua

(Southwest Institute of Technical Physics, Chengdu 610041, China)

Abstract: For the requirement of non-scanning 3D imaging lidar using the wavelength from 900-1700 nm, a 64×64 linear-mode avalanche photodiode focal plane array (LM-APD-FPA) was proposed, which was composed of InGaAs/InP avalanche photodiode array and CMOS read-out circuitry (ASIC). The working mode of this device was time-of-flight(TOF). APD converted the laser pulse into pulse current which was amplified and thresholded by read-out circuitry, then the laser detection was realized after the comparison of the threshold value, the laser pulse flight time of every pixel was obtained and being converted to binary codes for serial output. Testing results show that the minimal detectable power of 64×64 LM - APD - FPA is 400 nW, time resolution is 1 ns. This device is used in lidar system and realizes non-scanning single-pulse laser 3D imaging, indicating that the linear-mode laser focal plane array is useful in the field of laser 3D imaging.

Key words: focal plane array; linear mode; InGaAs; time of flight ranging; 3D imaging

收稿日期:2018-03-05; 修订日期:2018-04-03

基金项目:总装备部十二五预研项目

作者简介:李潇(1979-),男,研究员,博士,主要从事三维成像激光焦平面探测器方面的研究。Email:13618085492@139.com

0 引 言

非扫描三维激光主动成像是一项正在迅速发展的 高新技术,目前有多种传感器,其中基于 APD 阵列的 焦平面探测器是国内外的研究热点,按照 APD 的工作 偏置电压不同,分为线性和盖革两种体制,其中线性体 制的特点是可以对高速运动目标实现单脉冲瞬时成 像,具备恢复时间短、信号处理难度小、容易扩展规模 等优点^{III},它在主动激光成像制导、障碍规避、目标跟 踪^{III}和三维地形测绘等领域有广阔的应用前景。

InGaAs/InP 雪崩光电二极管具有在900~1700 nm 波段量子效率高、响应速度快、无需超低温工作及技 术成熟等特点。美国林肯实验室^[3]、波音公司^[4]、普林 斯顿光波公司^[5]、美国先进概念技术公司^[6]等研究机 构近年来在该领域开展了大量研究,阵列规模已达 到 265×256 以上,朝着大面阵^[7]、高灵敏度、高分辨 率及集成信号处理电路的智能化方向发展。国内主 要有西南技术物理研究所^[3-10]、中国电子科技集团公 司第四十四研究所^[9]、中国科学院上海技术物理研 究所^[10]等科研单位在从事相关研究。

文中报道了 InGaAs/InP 线性模式雪崩光电二极 管阵列,信号放大时间计数型 CMOS 读出电路以及 混合集成的 LM-APD-FPA 器件的设计和工艺制 备,对器件最小可探测光功率、时间分辨率等主要性 能参数进行了测试,结果达到预期水平,利用该器件 在激光三维成像平台上进行了三维成像功能演示。

1 线性模式雪崩焦平面阵列设计与制备

1.1 器件结构与工作原理

线性模式雪崩焦平面阵列器件结构及照片如 图1所示,由 InGaAs/InP 雪崩光电二极管阵列和在 像素级实现信号放大和时间计数的 CMOS 读出电路 芯片经 In 柱倒装互联混合集成。采用 256 针陶瓷壳 体为器件提供机械支撑与电气接口。





图 1 线性模式雪崩焦平面阵列器件结构(a)及照片(b) Fig.1 Structure (a) and photo (b) of LM-APD-FPA

整个探测器由规模为 64×64 的 APD 光敏芯片 阵列和读出电路构成,采用飞行时间(TOF)测距的工 作模式。工作原理如图 2 所示,一束激光发出的瞬 间,所有单元在外部控制时钟作用下开始计数,探测 器的 APD 光敏芯片阵列工作于线性模式,在设定的 距离门内如有激光脉冲进入,在 APD 的吸收区内产 生光电子并在雪崩电场的作用下撞击出更多光电 子,即产生雪崩增益,这个雪崩光电流再被该像素单 元进行放大、阈值比较后,产生一个 TTL 电平 STOP,该信号使读出电路计时电路停止计数并记录 该时刻信息,将其以二进制编码的形式读出到片外, 经数据处理,即可得到目标的三维距离图像。



1.2 线性模式雪崩光电二极管及其阵列

光敏芯片单管采用达通型分离吸收区、倍增区、 电荷区、能带梯度区的(SAGCM)结构,如图 3(a)所示。

如图 3(a),电荷区为倍增区提供高电场(5~6)× 10⁵ V/cm,同时为吸收区产生低电场(≤2×10⁵ V/cm), 保证在倍增区产生高雪崩增益的同时阻止在吸收区 产生隧道电流。由于雪崩发生在具有宽能隙的 InP 材料中(其能隙为 1.34 eV),而光吸收发生在具有窄 能隙的 InGaAs 材料中(其能隙为 0.73 eV),二者之间 存在势垒,使光生载流子在异质结发生堆积,影响芯 片响应时间。为了克服这一缺点,在这两种材料之间 引入三级能带梯度材料 $In_{1-x}Ga_xAs_yP_{1-y}$,其截止波长 分别为 λ_g =1.0 μ m、 λ_g =1.3 μ m、 λ_g =1.5 μ m,帮助在吸 收区产生的光生载流子容易进入倍增区。采用双浮 动保护环和凸 PN 结,阻止了 PN 结边缘由于弯曲引 起的过早击穿,使雪崩电场集中在光敏区(即 PN 结 区)的中心部分,得到高的平均雪崩增益。



传感器阵列芯片结构如图 3(b)所示,每个像元 的活动面(即 PN 结面)直径为 50 μm;为了减少像元 之间的串扰,采用沟道隔离;考虑到保护环和横向耗 尽宽度以及电子、空穴扩散长度,每个像元之间的间 隔目前为 150 μm,采用背进光结构。64×64 APD 光 敏芯片照片如图 4 所示。

64×64 APD 光敏芯片击穿电压和暗电流分布如 图 5 所示,在±0.2 V 范围内呈现正态分布,标准偏差

为 0.37 V, 暗电流均值为 3.41 nA。对存在的早击穿 点采取了屏蔽措施, 使其与相应的读出电路单元断 开从而不影响整个器件工作。





Fig.5 Histogram of breakdown voltage (a) and dark current (b) of the 64×64 APD array

1.3 读出电路结构与特性

该探测器的读出电路是一大规模高速数模混合 CMOS集成电路,每个单元包含了高速宽带前置放 大器和主要由移位寄存器(LFSR)构成的计时器单 元。由于雪崩信号的到达时刻是随机的,这就要求每 个像素要有独立的时间间隔测量功能。考虑到单元 像素电路面积的限制及电路简化的原则,采用时钟 计数的方法将雪崩信号的到达时刻转化为数字信 号,即计数器在雪崩信号到达时立即停止计数。读出 电路主要由数字外围电路、驱动电路和像素阵列三 部分组成,如图 6 所示。



Fig.6 Structure of the read-out circuit





图 7 读出电路版图和实物照片 Fig.7 Layout and photo of the read-out circuit

像素电路主要由前置放大器、像素计数电路和辅助电路组成。电路的输入级采用 RGC 结构,如图 8 所示,它有着非常低的输入阻抗和稳定的直流偏置。利用 RGC 结构作为输入级的前置放大器能更好地抑制光敏芯片寄生电容对前置放大器带宽的影响,经后级电压放大和比较整形后,输出一个标志光脉冲信号到达时刻的 STOP 信号,用于后续 TDC 电路的计时。



图 8 信号提取电路示意图 Fig.8 Schematic of the signal extraction circuit

兼顾测量距离和精度的要求,计时单元采用了 两段共14位计数器,其中主计数器10位,分辨率为 8ns;辅助计数器4位,分辨率为1ns,采用数字移相 技术,利用四相时钟(如图9中的G1~G4)相互之间



相移 90°,在较低的主频(125 MHz)下实现了最小1 ns 的时间分辨率。

2 性能参数测试

LM-APD FPA 的关键指标为最小可探测光功 率 P_{min}和时间分辨率 δ,最小可探测光功率定义为 使焦平面器件的有效像元与无光照时相比发生数据 位跳变的最小脉冲激光峰值光功率,时间分辨率定 义为探测器可分辨的最小光脉冲前沿时差。在工作 温度 300 K,APD 阵列偏压 40 V 的情况下,测量得到 最小可探测光功率平均值为 400 nW@1064 nm;时间 分辨率为 1 ns。

3 三维成像试验演示

该试验主要评估原理试验样机对人造目标的成 像能力及天气条件对成像的影响。试验在西南技术 物理研究所综合大楼 901 试验室进行。试验在晴朗及 微雨天气条件下进行,采用的激光器波长为1064 nm, 脉宽为 5 ns,单脉冲能量为 100 mJ,重频为 20 Hz;光 学接收镜头口径为 160 mm,64×64 激光焦平面探测 器占空比约为 5%,结果如图 10 所示。试验表明原理 试验样机能对 1 km 附近的人造目标实现三维成像, 空间分辨率达到 64×64,距离分辨率为 15 cm,对建 筑物的几何特征细节如阳台及墙面倾斜等有较好的 呈现能力。另外,试验也证实了微雨天气对原理样机 成像影响较小。以上试验验证了 64×64 InGaAs 雪崩 阵列探测器可以实现无扫描激光三维成像。



图 10 城市目标场景 3D 图像(1 km) Fig.10 Urban target scene and three-dimensional image (1 km)

4 结 论

研制了规模为 64×64, 中心距离为 150 μm 的背 进光式平面结构 InGaAs/InP 雪崩光电二极管阵列, 与专用 CMOS 集成电路通过 In 柱倒装互联工艺混 合集成的方式形成了 LM-APD-FPA 器件。经测试 表明,该器件在 300 K 温度下,平均最小可探测光功 率约为 400 nW@1064 nm,时间分辨率为 1 ns,采用 该器件实现了无扫描单脉冲激光三维成像。主要创 新点是在国内率先实现了用线性模式 APD 阵列和 专用集成电路形成了三维成像激光焦平面器件,和 其他体制的激光焦平面探测器相比,其主要优势在 于可以实现对高速运动目标的单脉冲瞬时成像,具 有成像速度快、无死时间和后脉冲、数据处理简单等 突出优点,在激光三维成像制导等军事领域有广阔 的应用前景。不足之处在于目前探测灵敏度较低,下 一步需要在光敏芯片材料、器件工艺、读出电路等方 面持续开展研究,以达到实用化水平。

参考文献:

- Roger Stettner, Howard Bailey Silverman. Eye-safe laser radar 3-D imaging[C]//SPIE, 2001, 5412: 46-56.
- [2] Chao I Chen, Roger Stettner. Drogue tracking using 3D flash lidar for autonomous aerial refueling [C]//SPIE, 2011, 8037: 80370Q.
- [3] Aull B F, Andrew H L, Young D J. Geiger-mode avalanche

photodiodes for three-dimensional imaging [C]//SPIE, 2004, 6014: 467-468.

- [4] Joseph Boaster, Ping Yuan, Paul McDonald, et al. Characterization of InGaAsP/InP APD arrays for SWIR imaging applications[C]//SPIE, 2004, 6214: 62140H.
- [6] Ilya Poberezhskiy, Andrew Johnson, Daniel Chang, et al. Flash lidar performance testing: configuration and results[C]// SPIE, 2012, 8379: 837905.
- [7] Roger Stettner, Howard Bailey. Large format time-of-flight focal plane detector development [C]//SPIE, 2005, 5791: 288-292.
- [8] Chen D Z, Zhang H, Leng J, et al. Active flash image lidar based on APD planar array [J]. Laser Technology, 2017, 41 (6): 775-778. (in Chinese)
- Zhang Xiuchuan, Jiang Liqun, Gao Xinjiang, et al. Fabrication of InGaAs/InP Geiger-mode avalanche focal plane arrays [J]. Semiconductor Optoelectronics, 2015, 36 (3): 356-391. (in Chinese)
- [10] Hao Lichao, Huang Aibo, Xie Xiaohui, et al. 32×32 very long wave infrared HgCdTe FPAs [J]. Infrared and Laser Engineering, 2017, 46(5): 0504001. (in Chinese)